

## TZ-602MAP 型自动探针测试台

高速高精度机型。具有 MAP 显示功能，主要适用于半导体分立元件，光电元件的自动中测，可遮光测试，具有 MAP 显示功能。它与测试仪连接后，能自动完成对各种晶体管芯的电参数测试及功能测试。

### 主要技术特点：

#### 工作台系统

- ※ 进口精密导轨丝杠工作台
- ※ 高速半闭环控制方式
- ※ 全封闭式结构,支持遮光测试、可测光敏元件
- ※ 支持测试仪及设备一体化（预留有集成空间）

#### 承片台

- ※ 承片台采用镀金工艺，上下片过程具有芯片防磨损功能
- ※ 承片台光电闭环控制

#### 探卡装置

- ※ 可调分离针探头/探卡兼容
- ※ 最多可布可调探头数 10 支、打点器 2 支、探边器 1 支

#### 电控系统

- ※ 采用嵌入式专用工控机，集成专用运动控制器
- ※ 电控系统增加了光电隔离、过流、过压保护
- ※ 集成网卡，支持设备联网；

#### 软件系统

- ※ Windows 友好界面，MAP 图动态显示测试过程
- ※ 同步/延时打点任选
- ※ 自动测试方式灵活多样（矩阵、探边、探高、圆形）



### 主要技术指标：

- 可测片径：3"、4"、5"、6"
- 显微镜：放大倍数 14X~90X
- 工作台行程：200mm×280mm
- 工作台速度：X：300mm/s Y：100mm/s
- 步进分辨率：0.001mm
- 定位精度：±0.005mm
- 重复精度：0.002mm
- 步距范围：0.005~99.999mm/0.001"~9.999"
  
- Z 向行程：0~3mm 可调
- Z 向重复精度：0.002mm
- Z 向分辨率：0.002mm



- 
- $\theta$  向调节范围： $\pm 15^\circ$
  
  - 外形尺寸：（长×宽×高）725mm×650mm×1400mm
  - 重量：200 kg
  - 功率：0.5kW
  - 电源：AC 220V $\pm$ 22V 50Hz $\pm$ 1Hz
  - 真空：0.08MPa（用户自备）
  
  - 使用温度环境：15°C~25°C
  - 相对湿度：<70%
  
  - 最大可布探头数：10 支
  - 延时打点个数：1~7 个 任选
  - 测试仪接口：TTL、RS232

▼ **选配附件：**

- ※ 螺旋式打点器；
- ※ 螺旋式探边器；
- ※ 螺旋式探头；
- ※ 探卡板；
- ※ 探卡装置；
- ※ 探卡刀针，棒针（规格可选）；
- ※ 真空泵（自备）；
- ※ 特种油墨：55ml/瓶、330ml/瓶（日本原装 TAT,红色,紫色,白色,黑色,绿色,蓝色可选）；
- ※ 钛合金/镀金（可选配，价格有差异）；
- ※ 二极管测试仪，其它测试仪的配备可根据用户需求订制；